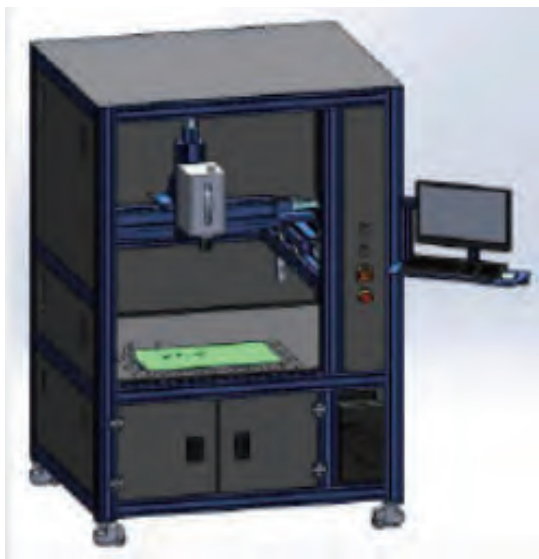


OLED 屏幕残影测试系统



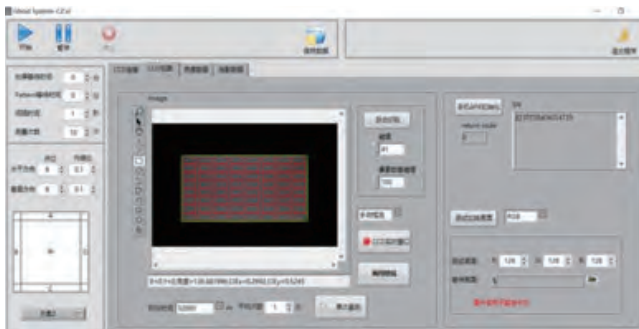
目前市面主流的 OLED 屏幕手机普遍存在烧屏现象，众所周知，烧屏现象是一个长期累积的过程，所以终端厂商普遍要求屏厂提供短期的残影测试报告，以便能够管控 OLED 屏幕的品质，降低烧屏现象；

ZL-ISS 是一套卓立汉光专门针对 OLED 屏幕短期残影的表征系统，采用高灵敏度的快速亮度计，实现高效表征屏幕的残影现象；

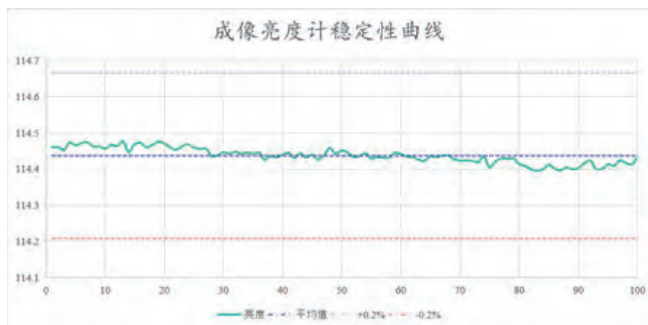
主要功能

- 短期残影测试；
- 亮度均匀性测试；
- 屏幕长期稳定性测试

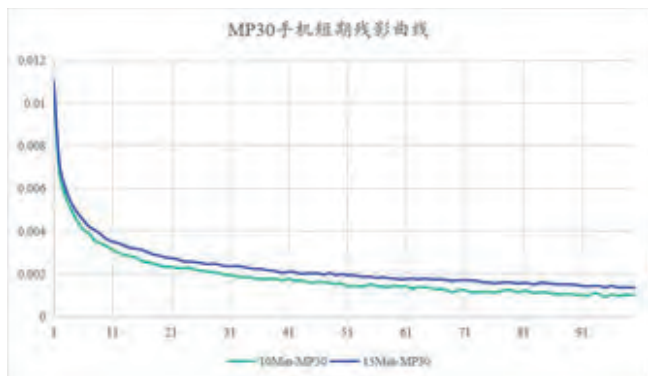
软件界面



探头稳定性曲线



某国产手机屏幕短期残影曲线



技术规格参数

亮度范围	0.0001 to 100000cd/m ²	亮度精度	±3%*1
像素	1900*1200	采样速率	≥1fps*2
镜头	24mm,28mm,35mm,50mm 可选	工作距离	> 350mm
空间分辨率	0.12mm*3	PG	可支持市面主流 厂商 PG
样品最大尺寸	190mmX110mm*3	样品类型	手机屏\模组
稳定性	<0.5%	Pattern	客户可自定义 Pattern

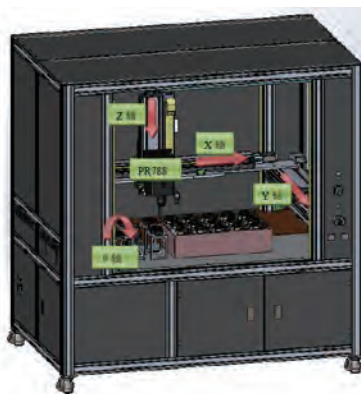
*1:A 光源条件下测试精度；*2: 曝光时间 <200ms；*3: 测试条件为 28mm 镜头，工作距离为 500mm

1. 多片式变温视角 IVL 自动测试系统

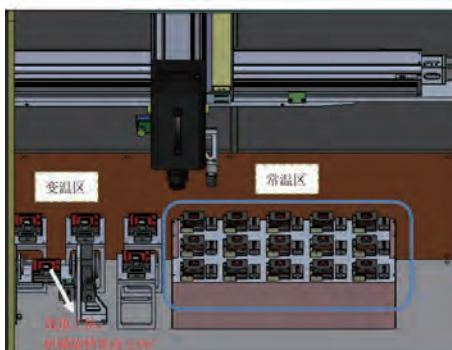
多片式变温视角 IVL 自动测试系统主要应用 TEG IVL 测试，进行视角测量的同时，也可配备加热治具用来测量不同温度下的产品属性。系统采用高精度高稳定性结构，利用我司专业的设计经验，强大的制作团队，从而为客户测量 IVL、视角、变温，推出一套优良的测试系统。



亮度计可XYZ三轴移动，变角治具可绕 θ 轴转动，以实现样品视角的测试；



测试区域分为常温区和变温区，变温区同时也可测试样品视角。可按客户需求定制。



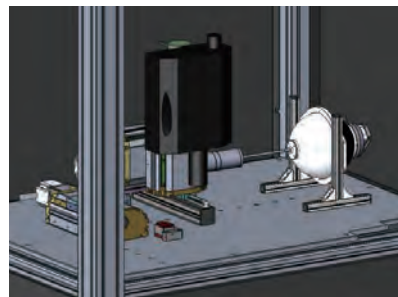
2. 多片式 IVL 自动测试系统

多片式 IVL 自动测试系统主要应用于大批量测试 IVL 性能曲线以及在视角变化过程中的亮度变化。主要面向 OLED 材料制作和 OLED 屏体生产的厂商。



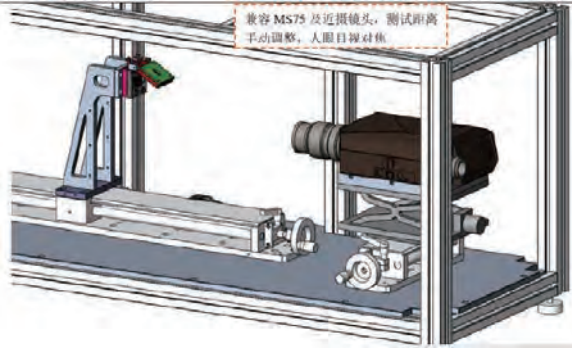
3. 单片式 IVL&EQE 自动测试系统

单片式 IVL 自动测量系统是集成 PR-670 或 PR-788 亮度计、自动位移台和对位 CCD 及 PC 的一套测试方案。同时提供了可搭载积分球测试 EQE 项目。



4. 单片式 IVL 手动测试系统

单片式 IVL 手动测量系统是集成 PR670 或 PR788 亮度计、手动滑台和对位 CCD 及 PC 的一套测试方案。



可选配件：EQE 积分球



5. 可放于手套箱内的紧凑型 IVL 测试系统

由于有机发光器件受环境影响较大，如果可将测试系统放入手套箱内，未封装的 OLED 器件就可进行 IVL 等光电参数测试，可有效提高工作效率，也可减小环境对器件发光参数的影响。

